FT110A

一微米定成败



镀层测厚仪系列
用于镀层测厚和成分分析

HITACHI 日立



FT110A – 测量极小目标

FT110A 帮助诸多的行业确保符合电镀规范，以避免出现性能低下的风险以及与废料或返工相关的成本。此外，该仪器可减少一系列测量所需的时间，从而帮助提高生产力。

在任何质量保证或质量控制系统中，准确性和可靠性均至关重要，拥有改良的 X 射线荧光技术的FT110A将使您的产品满足最高标准的行业规范要求。

借助更新的成像系统、全新的自动测量定位功能和大型样品台，确保这台镀层分析仪易于使用并提高分析效率。

基于 Windows 系统的 X-ray Station软件提供直观的用户界面，用户可对该仪器进行全面控制。

通过将数据直接整合到 Microsoft™ Word 和 Excel中来简化您的质量保证/质量控制流程。

为何如此多的实验室改为使用 FT110A?

1. 快速分析

强大的高灵敏度分析组件可以在数秒内测量镀层厚度和成分。

2. 无损

X 射线荧光是无损分析过程，不留任何痕迹。即使是对敏感性材料，其测量也是安全的；同时无需丢弃被测量过的样品。

3. 提高生产力

FT110A 的自动化功能意味着您可以更快地准备和测量样品，从而提高您的分析量。

4. 多功能性

FT110A 可以分析多达四层镀层和基材。可以使用基本参数 (FP) 或经验校准来测量镀层和材料成分（如金属合金或电镀液）。

5. 易于使用

培训可轻松完成，因此任何人都可以操作 FT110A。只需在工作台上设置样品，借助友好的界面指定测量区域，然后开始记录读数。用户界面可配置为仅显示日常操作所需的功能。

6. 兼容性

测量方法符合标准 ISO 3497、日立高新技术ASTM B568 和 DIN 50987。

©日立高新技术分析, 2026, 保留所有权利。

强大性和灵活性



FT110A 拥有一系列标准功能，能够以前所未有的快速性和简便性测量镀层厚度，其配置满足高要求的应用。

特点

- 多准直器组件 - 0.1 和0.2 毫米双准直器是标准配置，可灵活处理不同尺寸的零件。
- 广泛的分析范围 - 可确定从钛 (22) 到铀 (92) 等元素的镀层厚度。
- 校准和 FP 方法 - 使用经验和基本参数方法来确定薄膜厚度和成分。
- 大型测量室尺寸 - FT110A 可容纳尺寸高达 500 x 400 x150 毫米且重量达到 10 kg 的样品。
- 一键式测量 - 使用中心搜索功能进行简化的自动测量意味着几乎任何人都可以测试样品。

可选件

- 四准直器组件 - 通过加入 0.05 毫米和 0.025 x 0.4 毫米准直器，FT110A 的多功能性得以显著提升。
- 广视角相机 - 获取样品的鸟瞰图，然后快速放大您选择的测试区域。
- 自动对焦功能 - 无论样品厚薄或大小如何，FT110A 都可在几秒钟内自动对样品进行对焦。可从远至 80 毫米3.1 英寸）的距离测量样品，非常适合测量具有凹陷区域的零件，或者适用于测量不同高度的多个样品。
- 图像处理软件 - 使用图案识别软件快速的对复杂样品进行分析。操作员只需将测量区域放入视域，软件就会自动进行位置微调。

60多年来，Hitachi High-Tech 一直走在 X 射线荧光技术应用的前沿，并开发了全系列的分析仪器。

我们的服务

日立高新技术的全球服务中心网可以为
您正常工作提供全面的技术支持：

售后服务热线
无论您何时遇到问题，请拨打 400 622 5191，
我们都随时为您提供帮助。

在线诊断
透过我们的网站提供深入而快速的支持。

培训
帮助您充分利用分析仪及其全面的功能 。

延长保修期
让您完全安心使用且不产生计划外费用。

维修服务
我们通过服务协议提供快速高效的维修服务、再认证和维护，确保了您的分析仪时刻保持极佳状态，避免产生计划外的费用。

您所在的国家或地区可能要求操作员在使用基于 X 射线设备时接受基本安全培训。

其他产品



凭借超过60年开发 XRF 分析仪的丰富经验，我们为客户带来一系列相关产品：

RoHS筛选
针对包括邻苯二甲酸盐在内的RoHS污染物的专用解决方案。

手持式X射线荧光
用于便携式分析太大或太重而无法安装在台式系统中的零件镀层。

磁感应测厚仪
用于表面贴装和通孔技术的印制电路板铜的快速测厚。

联系我们

立即通过 contact@hitachi-hightech.com 联系我们的专家，安排演示。

销售热线：400 621 5191

更多信息

如需了解有关 FT110A 镀层厚度测量仪的更多内容，请访问 **hha.hitachi-hightech.com/zh/**

本出版物的版权归日立高新技术分析所有，其中仅提供概要性信息，除非本公司书面同意，否则不得为任何目的使用、应用或复制这些信息，这些信息也不得构成任何订单或合同的一部分或将其视为 与相关产品或服务有关的陈述。日立高新技术分析的政策将 不断完善。本公司保留更改任何产品 或服务的规格、设计或供应条款的权利，恕不另行通知。日立高新技术分析承认所有商标和注册。

©日立高新技术分析，2026，保留所有权利。

2026年3月

微信扫码
关注我们

HITACHI 日立